PACS numbers: 34.20.Cf, 36.40.Qv, 61.46.-w, 62.23.-c, 62.25.-g, 63.22.Kn, 81.05.U-

## Атомістика впливу силового поля на довговічність карбінграфенових наноелементів та аналогічних двовимірних наноструктур

С. О. Котречко<sup>1,2,3</sup>, Є. В. Коливошко<sup>1</sup>, А. М. Тимошевський<sup>1</sup>, Н. М. Стеценко<sup>1</sup>, О. В. Овсянніков<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Акад. Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна <sup>2</sup>Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01601 Київ, Україна <sup>3</sup>Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Берестейський, 37, 03056 Київ, Україна

Розглянуто атомні механізми флюктуаційно-індукованого розриву контактних зв'язків у карбін-графенових наноелементів в умовах дії силового поля. Встановлено наявність двох складових ефекту впливу силового поля на довговічність карбін-графенових наноелементів та аналогічних двовимірних наноструктур, а саме, (і) пониження висоти енергетичного бар'єру під дією сили та (іі) зменшення енергетичних витрат на розрив зв'язку за рахунок вивільнення накопиченої в наноелементі енергії пружніх деформацій. На прикладі карбін-графенового наноелементу показано, що вплив силового поля може спричиняти падіння довговічности на десятки порядків. Це є проявом синергії впливів температури та силового поля на стабільність і довговічність наноструктур. Одержано наближені аналітичні залежності, які уможливлюють із достатньою точністю прогнозувати довговічність таких двовимірних наноструктур, зокрема елементів стрейнтроніки. В теоретичному плані запропонований підхід можна розглядати як узагальнення Арреніюсової теорії реакцій на випадок дії силового поля.

Atomic mechanisms of the fluctuation-induced breaking of contact bonds in carbyne-graphene nanoelements under the force-field conditions are considered. Existence of two components of the force-field effect on the durability of carbyne-graphene nanoelements and similar two-dimensional nanostructures is ascertained, namely, (i) a decrease in the energy-barrier height un-

#### 10 С. О. КОТРЕЧКО, Є. В. КОЛИВОШКО, А. М. ТИМОШЕВСЬКИЙ та ін.

der the force action and (ii) a decrease in expenditure of energy for breaking the bond due to the release of elastic-deformations' energy accumulated within the nanoelement. As shown using the example of a carbynegraphene nanoelement, the impact of the force field can cause a drop in durability by tens of orders of magnitude. This is a manifestation of the synergy of the temperature and force-field effects on the stability and durability of nanostructures. Approximate analytical dependences are derived, which enable predicting the durability of such two-dimensional nanostructures, in particular, as straintronics elements, with sufficient accuracy. From a theoretical point of view, the proposed approach may be considered as a generalization of the Arrhenius theory of reactions to the case of forcefield action.

Ключові слова: карбін, карбін-графенові наноелементи, низьковимірна наноструктура, міцність, довговічність, Арреніюсова теорія.

Key words: carbyne, carbyne-graphene nanoelements, low-dimensional nanostructure, strength, durability, Arrhenius theory.

(Отримано 13 грудня 2022 р.)

## 1. ВСТУП

Особливістю сучасного етапу розвитку нанотехнологій є перехід до практичного використання наноелементів і наноструктур. Тому актуальною є проблема розвитку фізичних уявлень про мікромеханізми, що визначають їхні стабільність і довговічність за термомеханічного навантаження. На сьогодні молекулярна динаміка (МД) є найбільш адекватним інструментом для вирішення цієї проблеми, проте, часовий масштаб явищ, які можуть бути змодельовані МД, не перевищує кількох мікросекунд. Але слід зазначити, що терміни функціонування нанопристроїв вимірюються роками. У такій ситуації молекулярна динаміка може бути використана для встановлення закономірностей атомістики розриву атомових зв'язків у наноелементах, які можуть бути покладені в основу аналітичних моделів стабільности та довговічности наноелементів.

Зазвичай для оцінки ймовірности розриву міжатомового зв'язку використовуються Арреніюсова теорія реакцій [1] або її модифікації [2].

Дещо вдосконалений статистичний модель розриву зв'язків у наноелементах був запропонований у [3]. Цей модель уможливлює оцінити середній час очікування міґрації контактного зв'язку в карбін-графеновому наноелементі (КГН) за високих температур (1200–2000 К), а також середній час розриву міжатомового зв'язку в центральній частині карбінового ланцюжка. На відміну від Арреніюсової теорії реакцій, він не вимагає підганяння констант. Для розрахунків необхідно знати лише статичний потенціял на шляху мінімальної енергії. Для наноструктур цей потенціял можна одержати з першопринципних розрахунків (DFT). У [4] використали цей модель для аналізи впливу газоподібного середовища на термін служби карбінових і золотих ланцюжків за різних температур.

Особливістю цього та більшости інших подібних моделів є те, що вони призначені для оцінювання терміну служби механічно навантажених наносистем. В більшості випадків наявність силових полів зумовлено умовами експлуатації наноелементів (термосилове навантаження). Крім того, деформація ґратниці використовується з метою зміни функціональних (електричних, магнетних тощо) властивостей наноелементів. Цей перспективний напрям у нанофізиці називається «деформаційна електроніка» (straintronics) [5–7].

Основна ідея загальноприйнятого підходу до врахування впливу механічного навантаження на флюктуаційний розрив атомових зв'язків полягає в тому, що висота енергетичного бар'єру зменшується під дією силового поля. В цьому випадку постулюється лінійна залежність висоти енергетичного бар'єру від величини діючого напруження. Коефіцієнт перед напруженням розглядається як константа матеріялу — активаційний об'єм.

Цей підхід був розроблений для прогнозування довговічности макроскопічних твердих тіл [8]. В даний час робляться спроби перенести такий підхід на нанооб'єкти [9, 10]. Проте особливістю нанооб'єктів є саме нелінійна залежність висоти енергетичного бар'єру від механічного напруження [11, 12]. Принципово інший підхід запропоновано у [13]. Відповідно до цього підходу, величина критичної флюктуації, яка спричиняє розрив атомового зв'язку, не є постійною, а визначається рівнем діючого силового поля. Такий підхід уможливлює прогнозувати середній час очікування розриву міжатомового зв'язку в залежності від температури та величини механічного навантаження. Він був використаний для прогнозування тривалої довговічности карбін-графенових наноелементів, що складаються з графенових листів, з'єднаних карбіновим ланцюжком. Ключовою особливістю таких структур є наявність контактних зв'язків. Саме наявність цих зв'язків є причиною появи «зони нестабільности» (ЗН) на деформаційних кривих. Зони відіграють ключову роль під час руйнування наноелементу та визначають його довговічність [13, 14]. Причиною появи цих зон є те, що контактні зв'язки мають найменшу міцність; тому втрата їхньої стабільности (точка А на рис. 1) спричиняє вивільнення накопиченої в наноелементі енергії пружніх деформацій. Ця енергія витрачається на роботу з розриву контактного зв'язку, що сприяє його розриву, тобто відбувається своєрідне «закачуван-

11

ня» накопиченої енергії у контактний зв'язок.

В результаті довжина контактного зв'язку збільшується, а довжини сусідніх зв'язків, навпаки, зменшуються (рис. 1). Повна



Довжина контактного зв'язку  $L_{0-1}$ , Å

**Рис. 1.** Залежність сили F від довжини контактного зв'язку  $L_{0-1}$  та закономірності зміни довжин  $L_{i-j}$  зв'язків у ланцюжку.<sup>1</sup>



Рис. 2. Залежності значення загальної енергії КГН  $E_{tot}$  (*a*) та сили *F* (б) від довжини КГН.<sup>2</sup>

енергія системи залишається незмінною (рис. 2).

Ширина ЗН не є сталою і залежить від рівня прикладеної сили *F*. Розрахунки за DFT дають змогу визначити мінімальне значення нижньої межі ЗН  $F_{Rmin}$  за максимального значення сили  $F = F_{un}$ (де  $F_{un}$  — міцність зв'язку (рис. 1)). Перше наближення для силового впливу на нижню межу ЗН  $F_R$  є наступним [13]:

$$F_R = \sqrt{F_{un}^2 - \alpha F^2} , \qquad (1)$$

де  $\alpha$  — коефіцієнт, що характеризує частину накопиченої енергії, яка витрачається на розрив контактного зв'язку. Величина  $\alpha$  залежить від параметрів атомарної структури наноелементів і визначається за результатами розрахунків згідно з DFT.

Основним недоліком запропонованого моделю є необхідність використання чисельних методів для прогнозування ймовірности розриву контактного зв'язку і, відповідно, довговічности наноелементу. Це ускладнює встановлення основних закономірностей впливів температури та силового поля на стабільність і довговічність карбін-графенових наноелементів і аналогічних низьковимірних наноструктур, що складаються з комбінації одно- та двовимірних об'єктів.

Роботу спрямовано на встановлення ключових закономірностей, які контролюють довговічність карбін-графенових наноелементів, та одержання аналітичних залежностей для прогнозування їхньої довговічности у широкому діяпазоні температур і рівнів механічного навантаження. Ці закономірності можуть бути поширені на інші наноелементи, які складаються з комбінації однота двовимірних наноструктур.

## 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

## 2.1. Флюктуаційний модель

Для флюктуаційно-індукованого розриву контактного зв'язку в умовах дії силового поля атом, який зазнав критичного відхилу від рівноважного стану, має бути «підхоплений» прикладеною силою. Це означає, що величина критичної флюктуації міжатомової віддалі  $\delta_c$  задається рівнем прикладеної сили *F*. Відповідно до флюктуаційного моделю, запропонованого у [13], перше наближення для ймовірности розриву контактного зв'язку таке:

$$P(\delta \ge \delta_{C}) = \frac{1}{Z} \int_{\delta_{C}}^{\delta_{b_{r}}} \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta)\right] d\delta, \qquad (2)$$

де *Z* — статистична сума:

14 С. О. КОТРЕЧКО, Є. В. КОЛИВОШКО, А. М. ТИМОШЕВСЬКИЙ та ін.

$$Z = \int_{0}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta)\right] d\delta, \qquad (3)$$

у якій

$$\beta = \frac{1}{k_{\rm p}T},\tag{4}$$

де  $k_B$  — Больцманнова стала, T — температура, ε(δ) — флюктуація потенціяльної енергії:

$$\varepsilon(\delta) = E(u_f + \delta) - E(u_f), \qquad (5)$$

де  $E(u_f)$  та  $E(u_f + \delta)$  — значення енергії за зміщень атомів  $u_f$  внаслідок прикладеної сили F і флюктуації  $\delta$  відповідно;  $\delta_c$  — критичне значення флюктуації;  $\delta_{br}$  — величина флюктуації, необхідної для розриву атомового зв'язку за «нульового» значення прикладеної сили.

Коли контактний зв'язок втрачає стабільність, потенціяльна енергія, накопичена в системі, вивільняється, і це зменшує роботу зовнішніх сил, яка витрачається на розрив міжатомового зв'язку.

У загальному вигляді величина потенціяльної енергії визначається як

$$E(u) = \begin{cases} E(u_f), & \text{якщо } u \leq u_{un}, \\ E(u_{un}), & \text{якщо } u_{un} \leq u \leq u_R, \\ E(u_f) - [E(u_R) - E(u_{un})], & \text{якщо } u \geq u_R. \end{cases}$$
(6)

де  $E(u_{un}) \equiv E_{un}$  — величина потенціяльної енергії в точці нестабільности (що відповідає зміщенню атома  $u_{un}$ );  $E(u_R) \equiv E_R(F)$  — величина потенціяльної енергії за переміщення, яка відповідає нижній межі ЗН.

Відповідно, робота внутрішніх сил визначається ріжницею:

$$A_R(F) = E_R(F) - E_{un} \,. \tag{7}$$

## 2.2. Два механізми розриву контактного зв'язку

Залежно від співвідношення між величиною прикладеної сили Fі нижньою межею ЗН  $F_R$ , можливі два механізми розриву контактного зв'язку — «високоенергетичний» для  $F \leq F_R$  і «низькоенергетичний» для  $F > F_R$  [13].

Для  $F \leq F_R$  значення критичної флюктуації  $\delta_c$ , необхідної для

розриву контактного зв'язку, задається рівнем прикладеної сили *F*. У цьому випадку вираз для ймовірности реалізації критичної флюктуації описується залежністю

$$P_{I} = P(\delta \ge \delta_{C}) = \frac{1}{Z} \int_{\delta_{C}}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta \varepsilon_{IZ}(\delta)\right] d\delta, \qquad (8)$$

де  $\varepsilon_{IZ}(\delta)$  — флюктуація енергії з урахуванням роботи внутрішніх сил  $A_R(F)$ :

$$\varepsilon_{IZ}(\delta) = \varepsilon(\delta) - A_R(F).$$
(9)

З реалізацією другого («низькоенергетичного») механізму (для  $F > F_R$ ) після флюктуаційно-індукованої втрати стабільности контактного зв'язку величина сили, що діє в цьому зв'язку, не може перевищувати  $F_R$ . В результаті величина критичної флюктуації в цьому випадку визначається як

$$\delta_c \equiv \delta_R = u_R - u_f \,. \tag{10}$$

Відповідно,

$$P_{II} = P(\delta \ge \delta_C) = \frac{1}{Z} \int_{\delta_R}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta \varepsilon_{IZ}(\delta)\right] d\delta.$$
(11)

В обох випадках вираз для суми Z має такий вигляд:

$$Z = \int_{0}^{\delta_{un}} \exp\left[-\beta\varepsilon(\delta)\right] d\delta + (\delta_R - \delta_{un}) \exp\left[-\beta\varepsilon(\delta_{un})\right] + \int_{\delta_R}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta\varepsilon_{IZ}(\delta)\right] d\delta , (12)$$

де  $\delta_{un} = u_{un} - u_f$ .

Перехід від першого до другого механізму відбувається за умови, що величина прикладеної сили сягає нижньої межі ЗН. Відповідно до (1), значення цієї сили  $F^*$  дорівнює

$$F^* = \frac{F_{un}}{\sqrt{1+\alpha}} \,. \tag{13}$$

У загальному випадку залежності E(u) та F(u) можна одержати шляхом DFT-розрахунків, що дає змогу шляхом чисельного інтеґрування одержати ймовірність розриву контактного зв'язку та, відповідно, розрахувати середній час очікування цієї події  $\tau$ , тобто передбачити довговічність наноелементів:

$$\tau = \tau_0 / P(\delta \ge \delta_C), \qquad (14)$$

16 С. О. КОТРЕЧКО, Є. В. КОЛИВОШКО, А. М. ТИМОШЕВСЬКИЙ та ін.

де  $\tau_0$  — період коливань.

# 2.3. Наближені залежності для ймовірности розриву контактного зв'язку

Для аналізи ключових чинників, що визначають довговічність наноелементів, і для спрощення розрахунків одержано наближені залежності для  $P(\delta \ge \delta_c)$ .

1. За відсутности ЗН наближений вираз для ймовірности розриву контактного зв'язку можна одержати наступним чином. Підінтеґральну функцію розвинемо в ряд в околах  $\delta = \delta_c$  та  $\delta = 0$ , обмежившись першими двома членами ряду:

$$\varepsilon(\delta) \cong \varepsilon(0) + \varepsilon'(0)\delta = \varepsilon'(0)\delta, \ \varepsilon(\delta) \cong \varepsilon(\delta_c) + \varepsilon'(\delta_c)(\delta - \delta_c) \equiv \varepsilon_c(\delta).$$
 (15)

Тоді значення відповідного інтеґрала в (2) дорівнює

$$\int_{\delta_{c}}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta\varepsilon(\delta)\right] d\delta \cong \int_{\delta_{c}}^{\delta_{br}} \exp\left\{-\beta\left[\varepsilon(\delta_{c}) + \varepsilon'(\delta_{c})(\delta - \delta_{c})\right]\right\} d\delta = = -\frac{1}{\beta\varepsilon'(\delta_{c})} \exp\left[-\beta\varepsilon(\delta_{c})\right] \exp\left[-\beta\varepsilon'(\delta_{c})(\delta - \delta_{c})\right] \Big|_{\delta_{c}}^{\delta_{br}} = (16)$$
$$= \left[\left[\exp\left[-\beta\varepsilon'(\delta_{c})(\delta_{br} - \delta_{c})\right] < < \exp\left[0\right]\right] \cong \frac{1}{\beta\varepsilon'(\delta_{c})} \exp\left[-\beta\varepsilon(\delta_{c})\right].$$

Значення статистичної суми у рівнянні (3) стане таким:

$$Z = \int_{0}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta\varepsilon(\delta)\right] d\delta \cong \int_{0}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta\varepsilon'(0)\delta\right] d\delta =$$
  
=  $-\frac{1}{\beta\varepsilon'(0)} \exp\left[-\beta\varepsilon'(0)\delta\right] \Big|_{0}^{\delta_{br}} = \left[ \exp\left[-\beta\varepsilon'(0)\delta_{br}\right] << \exp\left[0\right] \right] \cong \frac{1}{\beta\varepsilon'(0)}.$  (17)

Відповідно, з формули (2) одержуємо такий наближений вираз для ймовірности розриву контактного зв'язку:

$$P(\delta \ge \delta_c) \cong \frac{1}{\beta \varepsilon'(\delta_c)} \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta_c)\right] \beta \varepsilon'(0) = \frac{\varepsilon'(0)}{\varepsilon'(\delta_c)} \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta_c)\right].$$
(18)

З умови сталости прикладеної сили  $\varepsilon'(\delta_c) \equiv \varepsilon'(0) = F$  маємо:

$$P(\delta \ge \delta_c) \cong \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta_c)\right]. \tag{19}$$

2. За наявности «високоенергетичної» ЗН всі міркування, пов'язані з формулою (2), є справедливими і для формули (8),

якщо  $\varepsilon(\delta)$  замінити в ній на  $\varepsilon_{IZ}(\delta) = \varepsilon(\delta) - A_R(F)$ , що враховує роботу внутрішніх сил. Тобто значення інтеґрала в (8) буде таким:

$$\int_{\delta_c}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta \varepsilon_{IZ}(\delta)\right] d\delta \cong \frac{1}{\beta \varepsilon_{IZ}'(\delta_c)} \exp\left[-\beta \varepsilon_{IZ}(\delta_c)\right].$$
(20)

3. Наявність «низькоенергетичної» зони нестабільности (див. формулу (11)). Підінтеґральну функцію розвинемо в ряд в околі  $\delta = \delta_R$ ; подібно до (15),

$$\varepsilon(\delta) \cong \varepsilon(\delta_R) + \varepsilon'(\delta_R)(\delta - \delta_R) \equiv \varepsilon_R(\delta).$$
(21)

Отже, значення відповідного інтеґрала в (11) дорівнює:

$$\int_{\delta_{R}}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta \varepsilon_{R}(\delta)\right] d\delta \cong \int_{\delta_{C}}^{\delta_{br}} \exp\left\{-\beta\left[\varepsilon(\delta_{R}) + \varepsilon'(\delta_{R})(\delta - \delta_{R})\right]\right\} d\delta = \\ = -\frac{1}{\beta \varepsilon'(\delta_{R})} \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta_{R})\right] \exp\left[-\beta \varepsilon'(\delta_{R})(\delta - \delta_{R})\right] \Big|_{\delta_{R}}^{\delta_{br}} =$$
(22)
$$= \left[\left[\exp\left[-\beta \varepsilon'(\delta_{R})(\delta_{br} - \delta_{R})\right]\right] << \exp\left[0\right]\right] \cong \frac{1}{\beta \varepsilon'(\delta_{R})} \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta_{R})\right].$$

Враховуючи, що  $\varepsilon'(\delta_R) = F_R$ , одержуємо:

$$\int_{\delta_R}^{\delta_{br}} \exp\left[-\beta \varepsilon_R(\delta)\right] d\delta \cong \frac{1}{\beta F_R} \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta_R)\right].$$
(23)

4. За наявности будь-якої ЗН статистична сума (12) перетворюється на

$$Z \simeq \frac{1}{\beta F} + (\delta_R - \delta_{un}) \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta_{un})\right] + \frac{1}{\beta F_R} \exp\left[-\beta \varepsilon(\delta_R)\right].$$
(24)

Безпосереднє числове інтеґрування для обчислення статистичної суми показує, що другий і третій доданки на багато порядків менші від першого (за температури у 600 К: другий доданок приблизно на 20 порядків, третій доданок — на 13 порядків); отже, ними можна нехтувати:

$$Z \cong (\beta F)^{-1}. \tag{25}$$

Ймовірність розриву контактного зв'язку за 1-го механізму становить

$$P_{\mathrm{I}} = P(\delta \ge \delta_{C}) \cong \exp\left[-\beta \varepsilon_{IZ}(\delta_{C})\right] = \exp\left\{-\beta\left[\varepsilon(\delta_{C}) - A_{R}(F)\right]\right\}.$$
(26)

Ймовірність розриву контактного зв'язку за 2-м механізмом становить

$$P_{II} = P(\delta \ge \delta_C) \cong \frac{\beta F}{\beta F_R} \exp\left[-\beta \varepsilon_{IZ}(\delta_R)\right] = \frac{F}{F_R} \exp\left\{-\beta \left[\varepsilon(\delta_R) - A_R(F)\right]\right\}, \quad (27)$$

де  $F_R$  визначається за формулою (1).

Порівняння точної та наближеної залежностей показує, що в наближеному варіянті  $P(\delta \ge \delta_c)$  дорівнює підінтеґральній функції в (2) та (8) відповідно. Особливістю залежности (27) є те, що вона чисельно дорівнює підінтеґральній функції в (11), помноженій на відношення активної сили до сили на нижній межі ЗН.

Коли немає ЗН (залежність (19)) і маємо  $P(\delta \ge \delta_c)$ , то з урахуванням (4) для  $\beta$  маємо:

$$P(\delta \ge \delta_c) \cong \exp\left(-\frac{E_0}{k_B T}\right), \qquad (28)$$

що збігається з виразом для ймовірности термоіндукованого подолання енергетичного бар'єру за Арреніюсовою теорією реакцій.

Відповідно до формул (14) і (19), (26), (27) середній час очікування розриву контактного зв'язку (тривалість довговічности) становить:

у разі відсутности ЗН

$$\tau \cong \tau_0 \exp[\beta \varepsilon(\delta_c)]; \tag{29}$$

для 1-го механізму

$$\tau \cong \tau_0 \exp\left\{\beta\left[\varepsilon(\delta_c) - A_R(F)\right]\right\};\tag{30}$$

для 2-го механізму

$$\tau \simeq \tau_0 \frac{F_R}{F} \exp\left\{\beta\left[\varepsilon(\delta_c) - A_R(F)\right]\right\}.$$
(31)

## 3. РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ

#### 3.1. Перевірка моделю

Для верифікації запропонованого моделю й оцінювання точности наближених залежностей ймовірности розриву контактного зв'язку використано результати молекулярно-динамічного моделювання деформації та руйнування карбін-графенового наноелементу, що складається з двох листів графену, з'єднаних карбіновим ланцюжком із десятьох атомів (рис. 3). Температура моделювання становила 750 К. Цей вибір температури дав змогу перевірити запропонований модель як для низькоенергетичного, так і для високоенергетичного механізму розриву зв'язку. Деталі техніки МД-моделювання описано в [15].

Згідно з даними на рис. 4 наближена аналітична залежність з достатньою точністю збігається з даними МД-моделювання. Ця залежність також добре узгоджується з результатами чисельного інтеґрування в діяпазоні значень прикладеної сили F від  $\cong 0,2F_{un}$  до  $\cong 0,98F_{un}$  (тут  $F_{un}$  — міцність контактного зв'язку).

Слід зазначити, що запропонований модель не дає змогу спрогнозувати термін служби з'єднання за відсутности навантаження. Якщо F = 0, значення критичної флюктуації  $\delta_c = \delta_R$ . У цьому випадку ймовірність  $P(\delta \ge \delta_c)$  реалізації такої флюктуації дорівнює 0, оскільки верхня та нижня межі інтеґрування однакові (залежність (8)). Відповідно, час очікування розриву контактного зв'язку прямує до нескінченности. З фізичної точки зору це



Рис. 3. Карбін-графеновий наноелемент з ланцюжком із 10 атомів.<sup>3</sup>



Рис. 4. Залежність часу довговічности  $\ln(\tau/\tau_0)$  від відносного навантаження  $F/F_{un}$  за температури T = 750 К [15]: --- результат чисельного інтеґрування рівнянь (8) і (11); — наближені залежності (30), (31); • — результат МД-моделювання.<sup>4</sup>

означає, що немає сили, яка має «підхопити» цю флюктуацію.

Як підкреслювалося вище, за навантажень, близьких до міцности зв'язку, запропонований модель дещо переоцінює термін служби, оскільки не враховує динамічні ефекти в ЗН (низькоенергетичний механізм). Як не дивно, наближена аналітична залежність не має цих недоліків. Для F = 0 вона дає скінченний час очікування критичної флюктуації і, як було показано вище, вона збігається із Арреніюсовою залежністю, а за максимального значення прикладеної сили  $F = F_{un}$  дає правильне значення ймовірности:  $P(\delta \ge \delta_c) = 1$ ; відповідно,  $\ln(\tau/\tau_0) = 0$ .

## 3.2. Наближення Морзе

Особливістю атомарної структури наноелементів, які складаються з комбінації одно- та двовимірних наноструктур, є наявність контактних зв'язків між цими структурами. У [16] це продемонстрували на прикладі 2D- та 3D-наноструктур, які можна сконструювати за допомогою графенових листів і карбінових ланцюжків. Як підкреслювалося вище, особливістю цих контактних зв'язків є те, що вони є найменш міцними, а отже, довговічність всього наноелементу визначається часом очікування розриву контактного зв'язку. В окремих ланцюжках зовнішні зв'язки мають найбільшу довжину і, отже, найменшу міцність. Дослідження показали, що за деформацій розтягу енергію міжатомової взаємодії в контактному зв'язку та діяграму його деформації можна з достатньою точністю апроксимувати потенціялом Морзе. Це уможливлює в явному вигляді одержати залежність висоти енергетичного бар'єру від величини прикладеної сили та з'ясувати закономірності впливу як міцности, так і енергії зв'язку на довговічність.

На рисунку 5 наведено результати DFT-розрахунків та апроксимацію їх для КГН з десятиатомовим карбіновим ланцюжком. Подібні залежності одержано також для КГН, що містить карбінові ланцюжки з числом атомів N від 3 до 10.

Залежність енергії взаємодії атомів від збільшення довжини контактного зв'язку описувалася виразом

$$E(u) = E_0 \left[ \exp(-2bu) - 2\exp(-bu) \right],$$
 (32)

а кривої «напруження-деформація» —

$$F(u) = \frac{dE(u)}{du} = 2bE_0 \left[ \exp(-bu) - \exp(-2bu) \right],$$
 (33)

де  $E_0$  — енергія контактного зв'язку, b — параметер, що харак-



Рис. 5. Залежності потенціяльної енергії E та сили F від видовження контактного зв'язку КГН u: О — DFT-розрахунки; --- наближення Морзе.<sup>5</sup>

теризує ширину потенціяльної ями.

Для апроксимації використовувалося значення енергії  $E_0$ , одержане за результатами DFT-розрахунків (рис. 5), а «ширина» потенціяльної ями *b*, використовувалася як параметер підганяння. З урахуванням наявности ЗН спочатку апроксимовано криву «напруження-деформація» (ЗЗ) і знайдено значення параметра *b*. Потім цю криву інтеґрували по області  $u_{un}$  до *u* на «хвості» залежности.

Згідно з одержаними даними (рис. 6) для КГН значення параметра *b* практично не залежить від кількости атомів у карбіновому ланцюжку та дещо зростає від  $b \approx 2,00$  Å<sup>-1</sup> до  $\approx 2,05$  Å<sup>-1</sup> з переходом від КГН з парною кількістю атомів до КГН з непарною кількістю атомів. У цьому проявляється одна з особливостей взаємодії атомів у контактних зв'язках КГН.

З іншого боку, це значно спрощує розрахунки, оскільки для побудови деформаційних залежностей як енергії, так і сили взаємодії атомів у контактному зв'язку достатньо знати лише значення енергії зв'язку  $E_0$ .

Ширина ЗН характеризується параметром α. Згідно з (1)

$$\alpha = 1 - \left(\frac{F_{R\min}}{F_{un}}\right)^2, \qquad (34)$$

де  $F_{R\min}$  — нижня межа ЗН, яка, як і  $F_{un}$ , визначається за результатами DFT-розрахунків (рис. 5).



Рис. 6. Залежність значення параметра потенціялу Морзе b від кількости атомів у ланцюжку КГН.<sup>6</sup>



Рис. 7. Залежність значення параметра  $\alpha$  від кількости атомів у ланцюжку КГН.<sup>7</sup>

Згідно з DFT-розрахунками для КГН значення α залежить від того, парним чи непарним є число атомів у ланцюжку. Його величина лежить у вузькому інтервалі від 0,89 до 0,98 (рис. 7).

Використання потенціялу Морзе уможливлює одержати вирази для часу довговічности в явному вигляді. Для того, щоб одержати формули для часу довговічности (29)–(31) як функції прикладеної сили, спочатку потрібно одержати вирази як для довжини критичної флюктуації контактного зв'язку, необхідної для його розриву, так і для відповідних флюктуацій енергії, а також роботи внутрішніх сил, що входять до наведених вище формул. Потенціял Морзе в диференціяльній формі (33) був використаний для відповідних розрахунків. Для цього рівняння було розв'язано відносно значення переміщення *u*:

$$E'(u) = F(u) = F$$
, (35)

і одержано два корені —  $u_1(F)$  і  $u_2(F)$ :

$$u_{1,2}\left(F\right) = \left(-\frac{1}{b}\right) \ln\left(0,5\pm 0,5\sqrt{1-\overline{F}}\right),\tag{36}$$

де

$$F = 2F/(bE_0) = F/F_{un}$$
, (37)

оскільки параметри потенціялу Морзе та величина сили нестабільности пов'язані наступним чином (з умови рівности 0 другої похідної потенціялу  $d^2E(u)/du^2 = dF(u)/du = 0$ ):

$$F_{un} = F_{max} = \frac{E_0 b}{2}.$$
 (38)

Відповідно, величина критичної флюктуації довжини контактного зв'язку дорівнює

$$\delta_{C}(F) = u_{2}(F) - u_{1}(F) = \frac{2}{b} \tanh^{-1}\left(\sqrt{1 - \frac{2F}{bE_{0}}}\right) = \frac{2}{b} \tanh^{-1}(\sqrt{1 - \overline{F}}) .$$
(39)

Вираз для величини флюктуації енергії в загальному випадку —

$$\varepsilon(F) = E_0\left(\left\{\exp\left[-b(u_f+\delta)\right] - 1\right\}^2 - \left\{\exp(-bu_f) - 1\right\}^2\right).$$
(40)

Критична флюктуація енергії (енергетичний бар'єр) — це

$$\varepsilon_{c}(F) = E(u_{f} + \delta) - E(u_{f}) = E_{0}\sqrt{1 - \frac{2F}{bE_{0}}} = E_{0}\sqrt{1 - \frac{F}{F_{un}}}.$$
 (41)

Відповідно,

$$u_{R}(F) = -\frac{1}{b} \ln \left( 0, 5 - 0, 5\sqrt{1 - \sqrt{1 - \alpha \overline{F}^{2}}} \right),$$
(42)

$$\delta_{R}(F) = u_{R} - u_{f} = -\frac{1}{b} \ln \frac{1 - \sqrt{1 - \alpha \overline{F}^{2}}}{1 + \sqrt{1 - \overline{F}}}, \qquad (43)$$

$$E_{R}(F) = E(u_{R}) = E_{0}\left(0, 5+0, 5\sqrt{1-\sqrt{1-\alpha\bar{F}^{2}}}\right)^{2}, \qquad (44)$$

С. О. КОТРЕЧКО, Є. В. КОЛИВОШКО, А. М. ТИМОШЕВСЬКИЙ та ін.  $\mathbf{24}$ 

$$\varepsilon_R(F) = E(u_R) - E(u_f) = \frac{1}{4} E_0 \left[ \left( 1 + \sqrt{1 - \overline{F}_R} \right)^2 - \left( 1 - \sqrt{1 - \overline{F}} \right)^2 \right].$$
(45)

Величина видовження контактного зв'язку, значення критичної флюктуації й енергія у момент нестабільности описуються наступним чином:

$$u_{un} = b^{-1} \ln 2, \qquad (46)$$

$$\delta_{un}(F) = u_{un} - u_f = \frac{\ln\left(1 + \sqrt{1 - \overline{F}}\right)}{b}, \qquad (47)$$

-

$$E_{un} = E(u_{un}) = E_0/4.$$
 (48)

Робота внутрішніх сил —

$$A_{R}(F) = E_{R} - E_{un} = \frac{1}{4} E_{0} \left[ \left( 1 + \sqrt{1 - \alpha \overline{F}^{2}} \right)^{2} - 1 \right]$$
(49)

або

$$A_{R} = \frac{1}{4} E_{0} \left[ \left( 1 + \sqrt{1 - \overline{F}_{R}} \right)^{2} - 1 \right],$$
 (50)

де

$$\overline{F}_R = \sqrt{1 - \alpha \overline{F}^2} \,. \tag{51}$$

Підставляючи значення (41), (45) і (49) у формули (29), (30) і (31), одержуємо відповідні формули для довговічности в явному вигляді: для випадку без ЗН —

$$\ln\frac{\tau}{\tau_0} = \frac{E_0}{k_B T} \sqrt{1 - \overline{F}} ; \qquad (52)$$

для 1-го механізму —

$$\ln\frac{\tau}{\tau_0} = \frac{E_0}{k_B T} \left\{ \sqrt{1 - \overline{F}} - \frac{1}{4} \left[ \left( 1 + \sqrt{1 - \alpha \overline{F}^2} \right)^2 - 1 \right] \right\}; \quad (53)$$

для 2-го механізму —

$$\ln\frac{\tau}{\tau_0} = \ln\frac{\sqrt{1-\alpha\overline{F}^2}}{\overline{F}} + \frac{1}{4}\frac{E_0}{k_BT}\left[1 - \left(1 - \sqrt{1-\overline{F}}\right)^2\right];$$
 (54)

тут

$$\overline{F} = F/F_{un} \,. \tag{55}$$

Згідно з цими залежностями величина логаритму часу довговічности є пропорційною відношенню енергії контактного зв'язку до кінетичної енергії та нелінійно залежить від величини прикладеної сили, нормованої на силу  $F_{un}$ . Вплив накопиченої енергії пружніх деформацій (ширина ЗН) описується значенням параметра  $\alpha$ . У залежності (54) для 2-го механізму параметер  $\alpha$  стоїть під логаритмом; тому вплив ширини ЗН на довговічність для 2-го механізму є значно меншим.

Застосування функції Морзе для апроксимації взаємодії атомів у контактному зв'язку дає змогу детально проаналізувати вплив температури та діяльної сили на точність наближених залежностей (30) і (31). Таку 3D-карту точности представлено на рис. 8. Висота тут характеризує величину відносної похибки логаритму тривалости довговічности:

$$r = \frac{\ln^* \frac{\tau}{\tau_0} - \ln \frac{\tau}{\tau_0}}{\ln \frac{\tau}{\tau_0}} \times 100\%,$$
 (56)

де  $\ln \frac{\tau}{\tau_0}$  — логаритм часу довговічности, розрахований чисель-

ним інтеґруванням (точне значення за залежностями (8) і (11)), ln<sup>\*</sup> <sup>т</sup> — логаритм часу довговічности, обчислений за наближени-

 $T_0$  т<sub>0</sub> (22) : (21) И

ми залежностями (30) і (31). На цьому графіку значення прикладеної сили  $F_{un}$  нормовано за міцністю зв'язку. Розрахунки проводили для значень  $\alpha = 0.935$ , b = 2.00 Å<sup>-1</sup> та величини енергії контактного зв'язку  $E_0 = 6.07$  еВ, що відповідає КГН з 10-атомовим карбіновим ланцюжком (рис. 9). Однак одержана карта є слушною і для інших значень  $E_0$ , оскільки довговічність залежить не від абсолютного значення  $E_0$ , а від  $k_B T/E_0$ .

Одержані дані свідчать, що використання наближених залежностей для довговічности цілком виправдане значним розкидом значення часу довговічности, що є наслідком стохастичної природи процесу розриву контактного зв'язку.

Аналіза карти похибок показує, що максимальні відхили наближеної залежности від точної спостерігаються за значення прикладеної сили, близького до нуля, та за великих значень її, які становлять 0,95–0,98 міцности контактного зв'язку. Причини цих розбіжностей обговорювалися у підрозділі «Перевірка моде-

25



Рис. 8. 3*D*-карта точности наближеної залежности.<sup>8</sup>



**Рис. 9.** Вплив кількости атомів N на енергію контактного зв'язку КГН  $E_0$ .<sup>9</sup>

лю». Всередині цього інтервалу збільшення величини прикладеної сили розширює температурний діяпазон, де можна використовувати наближені залежності. Зокрема, за величин прикладеної сили  $F \ge 0.3F_{un}$  і температур не вище 1000 К похибка наближених залежностей становить близько 1% (область нижче відповідної ізолінії), а за похибки у 2% верхня межа температури зростає до 1500 К. Ця точність цілком достатня, враховуючи, що температурний діяпазон практичного використання КГН не перевищує 1000–1500 К.

## 3.3. Механічна активація

Як зазначалося вище, за відсутности силового поля (F = 0) зале-

жність (19) перетворюється в Арреніюсів вираз, що описує термоактивований перехід через енергетичний бар'єр. Це означає, що в загальному випадку ( $F \ge 0$ ) одержані залежності (26) і (27) уможливлюють описати додатковий ефект, який полягає в механічній активації подолання енергетичного бар'єру. Цей ефект має дві складові. Одна з них — зменшення висоти бар'єру під дією силового поля, друга — зменшення роботи розриву зв'язку в результаті вивільнення накопиченої енергії пружніх деформацій.

Зменшення висоти енергетичного бар'єру за даної сили чисельно дорівнює енергії критичної флюктуації для цього рівня сили. У термінах потенціялу Морзе цей вираз виглядає так (формула (41)):

$$\Delta E = \varepsilon_c(F) = E_0 \sqrt{1 - \frac{F}{F_{un}}}, \qquad (57)$$

де вираз для  $F_{un}$  має вигляд

$$F_{un} = \frac{bE_0}{2}.$$
 (58)

Друга складова — це робота внутрішніх сил (формули (50), (51)):

$$A_{R}(F) = \frac{1}{4} E_{0} \left[ \left( 1 + \sqrt{1 - \frac{F_{R}}{F_{un}}} \right)^{2} - 1 \right],$$
 (59)

де  $F_R$  — нижня межа ЗН (1).

Слід зазначити, що друга складова механічної активації безпосередньо пов'язана з флюктуаційним механізмом розриву міжатомових зв'язків. Накопичена енергія пружніх деформацій виділяється лише за умови флюктуаційно-індукованої втрати стабільности контактного зв'язку. У цьому випадку теплові коливання діють як триґер, який вивільняє накопичену енергію. Цей ефект є причиною синергії впливів температури та силового поля на довговічність наноелементів. Відповідно до (59) і (1) кількість виділеної енергії може змінюватися від  $A_R = 0$  (для  $\alpha = 0$ ) до максимального значення  $A_{Rmax} = 3E_0/4$  (для  $\alpha = 1$ ). Для карбінграфенових наноелементів із десятиатомовим карбіновим ланцюжком ( $\alpha = 0,94$ )  $A_{Rmax} \approx 0,6E_0$ .

Кількісно вплив цих двох складових показано на рис. 10. За відсутности силового поля довговічність КГН описується Арреніюсовою залежністю (крива 4). Залежність часу довговічности від величини діяльної сили з урахуванням ефекту зменшення висоти енергетичного бар'єру під дією цієї сили описується кривою 1.



Рис. 10. Вплив значення параметра  $\alpha$  зони нестабільности КГН на залежність часу довговічности від величини відносного навантаження. (T = 600 K,  $E_0 = 6,07$  eB,  $\tau_0 = 0,042$  пс): 1 — без зони нестабільности ( $\alpha = 0$ ); 2 —  $\alpha = 0,5$ ; 3 — максимальна ширина зони нестабільности,  $\alpha = 1$ ; 4 — Арреніюсова залежність.<sup>10</sup>

Криві 2 і 3 характеризують довговічність з урахуванням другої складової механічної активації розриву зв'язку (енергії пружніх деформацій) для двох значень параметра а. Для  $\alpha = 1$  виділяється максимальна кількість «пружньої» енергії.

Відповідно до даних на рис. 10 дія силового поля може викликати значне (на десятки порядків) зменшення часу довговічности наноелементу. Внесок другої складової у падіння довговічности зростає зі збільшенням величини прикладеної сили. За відносного навантаження  $F/F_{un} = 0,2$  довговічність зменшується у  $\cong 100$ разів, а за навантаження у 0,71 відповідне зменшення сягає 5,7·10<sup>28</sup> разів. У результаті за відносного навантаження  $F/F_{un} = 0,71$  внесок другої складової може викликати зменшення тривалости довговічности від 3·10<sup>6</sup> років до 27 хвилин для  $\alpha = 0,5$ і до 44 мкс для  $\alpha = 1$ .

Розглянутий ефект має ключове значення для практичного використання наноелементів. Зокрема, це, в першу чергу, важливо для елементів деформаційної електроніки (straintronics), де управління функціональними властивостями здійснюється за рахунок деформації наноелементу. З іншого боку, встановлені закономірності стосуються процесів впливу силового поля на термофлюктуаційне подолання енергетичного бар'єру. Це уможливлює також зрозуміти та кількісно описати атомістику механічної активації хемічних реакцій. Відповідно до (14) і (19) швидкість (частота v) таких реакцій описуватиметься залежностями:

$$\nu = \frac{1}{\tau_0} \exp\left\{-\beta \left[\varepsilon(\delta_c) - A_R(F)\right]\right\},\tag{60}$$

$$\nu = \frac{F}{\tau_0 F_R} \exp\left\{-\beta \left[\varepsilon(\delta_R) - A_R(F)\right]\right\}.$$
 (61)

Феноменологічні моделі часу довговічности твердих тіл макророзмірів зазвичай використовують лінійний закон зменшення висоти енергетичного бар'єру під дією силового поля:

$$E = E_0 - V\sigma, \qquad (62)$$

де σ — діяльне напруження, V — активаційний об'єм.

Слід зазначити, що останнім часом робилися спроби перенести цю залежність на нанооб'єкти [9, 10]. Розвиваючи (57) у Тейлорів ряд, легко побачити, що лінійне наближення справедливе лише за малих значень діяльної сили:

$$E \approx E_0 - \frac{1}{b}F.$$
 (63)

Зокрема, для карбін-графенового наноелементу ця залежність дає похибку для E менше 5–10% лише за відносної сили, що не перевищує  $F \le 0.14-0.20$  міцности зв'язку.

#### 4. ВИСНОВКИ

1. Термін служби та термомеханічна стабільність карбінграфенових наноелементів і нанооб'єктів, що складаються з 1Dта 2D-наноструктур контролюється часом очікуванням флюктуаційно-індукованого розриву контактних зв'язків.

2. Вплив силового поля на флюктуаційний розрив контактних зв'язків зумовлений двома основними складовими: (i) зменшенням висоти енергетичного бар'єру; (ii) зменшенням енергетичних витрат на розрив зв'язку через вивільнення накопиченої енергії пружньої деформації. Зазвичай вплив другої складової не враховують у наявних моделях, але він зростає зі збільшенням сили; за сили, що перевищує половину міцности зв'язку, вплив цієї складової стає співмірним із впливом першої складової. Для карбінграфенових наноелементів вплив цієї складової може викликати зменшення довговічности від тисяч років до десятків мікросекунд. 3. Для карбін-графенових наноструктур використання лінійної залежности висоти енергетичного бар'єру від величини сили є коректним лише в області малих сил, значення яких не перевищують 15–20% міцности зв'язку.

4. Кількісно вплив силового поля на довговічність наноструктур можна з достатньою точністю описати експоненційною функцією величини енергетичного бар'єру, висота якого нелінійно зале-

жить від сили та зменшується на величину вивільненої енергії пружніх деформацій.

## ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА-REFERENCES

- S. Arrhenius, Z. Phys. Chem., 4U, No. 1: 96 (1889a) (in German); https://doi.org/10.1515/zpch-1889-0408
- 2. H. A. Kramers, *Physica*, 7, No. 4: 284 (1940); https://doi.org/10.1016/S0031-8914(40)90098-2
- 3. Z. Z. Lin, W. F. Yu, Y. Wang, and X. J. Ning, *Europhys. Lett.*, 94: 40002 (2011); https://doi.org/10.1209/0295-5075/94/40002
- 4. Z. Z. Lin and X. Chen, *Europhys. Lett.*, **101**: 48002 (2013); https://doi.org/10.1209/0295-5075/101/48002
- 5. V. M. Pereira and A. C. Neto, *Phys. Rev. Lett.*, **103**: 046801 (2009); https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.046801
- D. Zhan, J. Yan, L. Lai, Z. Ni, L. Liu, and Z. Shen, Adv. Mater., 24: 4055 (2012); https://doi.org/10.1002/adma.201200011
- G. G. Naumis and P. Roman-Taboada, *Phys. Rev. B*, 89: 241404 (2014); https://doi.org/10.1103/PhysR evB.89.241404
- 8. S. N. Zhurkov, Int. J. Fract. Mech., 1: 311 (1965); https://doi.org/10.1007/BF03545562
- T. Zhu, J. Li, A. Samanta, A. Leach, and A. K. Gall, *Phys. Rev. Lett.*, 100: 025502 (2008); https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100. 025502
- 10. X. Yang, Y. Huang, B. Cao, and A. C. To, *Physica E*, **93**: 124 (2017); https://doi.org/10.1016/j.physe.2017.06.006
- T. Dumitrica, M. Hua, and B. I. Yakobson, P. Natl. Acad. Sci. USA, 103, No. 16: 6105 (2006); https://doi.org/10.1073/pnas.0600945103
- 12. A. I. Slutsker, *Phys. Solid State*, **46**: 1658 (2004); https://doi.org/10.1134/1.1799183
- S. Kotrechko, A. Timoshevskii, E. Kolyvoshko, Yu. Matviychuk, and N. Stetsenko, *Nanoscale. Res. Lett.*, **12**: 327 (2017); https://doi.org/10.1186/s11671-017-2099-4
- S. Kotrechko, A. Timoshevskii, E. Kolyvoshko, Yu. Matviychuk, N. Stetsenko, and B. Zhang, *Eur. Phys. J. Plus.*, 134: 182 (2019); https://doi.org/10.1140/epjp/i2019-12611-5
- S. Kotrechko, A. Timoshevskii, E. Kolyvoshko, Y. Matviychuk, and N. Stetsenko, *Procedia. Struct. Integr.*, 28: 116 (2020); https://doi.org/10.1016/j.prostr.2020.10.015
- A. Timoshevskii, S. Kotrechko, and Yu. Matviychuk, *Comput. Mater. Sci.*, 128, No. 15: 223 (2017); https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2016.11.037

<sup>1</sup>G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine,

UA-03142 Kyiv, Ukraine

60, Volodymyrska Str.,

UA-01601 Kyiv, Ukraine

<sup>3</sup>National Technical University of Ukraine 'Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute',

<sup>36,</sup> Academician Vernadsky Blvd.,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Taras Shevchenko National University of Kyiv,

<sup>37,</sup> Beresteiskyi Ave.,

UA-03056 Kyiv, Ukraine

<sup>3</sup> Fig. 3. Carbyne-graphene nanoelement with 10-atoms' chain.

<sup>4</sup> Fig. 4. Lifetime  $\ln(\tau/\tau_0)$  dependence on the relative load  $F/F_{un}$  at the temperature T = 750 K [15]: ----the numerical integration of (8) and (11); —--the approximate dependences (30),

(31);  $\bullet$ -MD simulation. <sup>5</sup> Fig. 5. Dependences of potential energy E and force F on the CGN contact-bond elongation u: O—DFT calculations; ----Morse approximation. <sup>6</sup> Fig. 6. Dependence of parameter b on the number of atoms in a CGN chain.

<sup>7</sup> Fig. 7. Dependence of parameter  $\alpha$  on the number of atoms in a CGN chain.

<sup>9</sup> Fig. 9. CGN binding-energy  $E_0$  dependence on the number of atoms N.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fig. 1. Dependence of force F on the bond length  $L_{0-1}$ , and the regularities of changes of length  $L_{i-j}$  in the chain.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fig. 2. Dependences of the CGN total-energy value  $E_{tot}$  (a) and force F (b) on the CGN length.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fig. 8. 3D map of errors of approximate dependences.

 $<sup>^{10}</sup>$  Fig. 10. CGN-lifetime dependence on the relative magnitude of applied force (T = 600 K,  $E_0 = 6.07$  eV,  $\tau_0 = 0.042$  ps) at different values of instability zone parameter  $\alpha$ : 1—there is no the instability zone ( $\alpha = 0$ ); 2- $\alpha = 0.5$ ; 3-the maximum instability-zone width,  $\alpha = 1$ ; 4-Arrhenius's dependence.